

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55 °C ~ 85 °C (注1)	保存温度範囲	-10 °C ~ 60 °C	
	電 圧	AC/DC 30 V			
	電 流	信号端子 : 1.0 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。	信号端子接触抵抗 : 50 mΩ以下 $\triangle$	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
	V. S. W. R.	周波数 : 0~1 GHz	1.2 Max.	○	—
		周波数 : 1~6 GHz	1.3 Max.		
周波数 : 6~20 GHz		1.5 Max.			
機 械 的 性 能	繰り返し動作	10 回の抜き差しを行う。	①信号端子接触抵抗 : 50 mΩ以下 $\triangle$ ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	①1 $\mu$ s以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 $\mu$ s以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40 $\pm$ 2 °C, 湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①信号端子接触抵抗 : 50 mΩ以下 $\triangle$ ②絶縁抵抗 : 100 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 °C $\rightarrow$ 85 °C 時間 30 $\rightarrow$ 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2~3 分)	①信号端子接触抵抗 : 50 mΩ以下 $\triangle$ ②絶縁抵抗 : 50 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	二酸化硫黄	濃度25 ppm, 25 °C, RH 75 % に96 時間放置する。	①信号端子接触抵抗 : 50 mΩ以下 $\triangle$	○	—
	$\Delta$ の数	訂正記事	設計	検図	年月日
$\triangle$	5	DIS-H-00018586	RT. SHIMIZU	TY. 001	20230707
備考			承認	TY. 001	20230314
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	RT. SHIMIZU	20230314
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用しています。			担 当	PAN YIWEI	20230313
			製 図	PAN YIWEI	20230313
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番 SLC-387490-51-00		
<b>HRS</b>	製品規格表		製品名 BM56G-10DS-0.35V(51)		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード CL0673-7501-0-51 $\triangle$ 1/1		